

目次

	ページ
【1】 周期境界上の近接場 [招待講演]	1
高橋信行 (滋賀県立大学国際教育センター)	
【2】 NSOMイメージングのための一定距離走査法と一定高度走査法の比較 -FDTDによる電磁場解析-	7
古川祐光, 河田 聡 (大阪大学工学部)	
【3】 境界要素法による2D近視野光学回路シミュレーション	13
田中雅宏*, 田中嘉津夫** (常葉学園浜松大学*, 岐阜大学**)	
【4】 微小突起型プローブ設計のための境界要素法による電磁波解析	19
小早川修, 片岡俊彦, 遠藤勝義 (大阪大学工学部)	
【5】 エバネッセント波によるファイバプローブ中のモード励振の理論解析II	25
石堂能成, 角井嘉美 (電子技術総合研究所 大阪ライフエレクトロニクス研究センター)	
【6】 Photon STMと光の散乱問題	27
坂野 斎 (山梨大学工学部)	
【7】 微小誘電体間の光近接場相互作用	33
井上哲也, 加藤 彰, 土屋和彦, 坂野 斎, 堀 裕和 (山梨大学工学部)	
【8】 TopoMatrix社フォトン走査顕微鏡の紹介とその測定例 [招待講演]	39
藤田幸市 (日製産業株式会社 科学システム輸入部)	
【9】 フォトカンチレバーを用いたNSOMにおける光検出メカニズム	44
福澤健二, Shinya Akamine, 桑野博喜 (NTT境界領域研究所)	
【10】 有機分子薄膜のフォトカンチレバーによるSNOM/AFM観察	47
山田啓文*, Suzanne P. Jarvis*, 戸田明敏**, 徳本洋志* (産業技術融合領域研究所*, オリンパス光学工業**)	
【11】 非古典・非線形光の観測になぜ近接場光学が必要か? [招待講演]	51
花村榮一 (東京大学工学部)	
【12】 金属プローブを用いた反射型ニアフィールド光学顕微鏡と 微細構造をもつ半導体試料の観察	53
井上康志, 河田 聡 (大阪大学工学部)	
【13】 フォトン走査型トンネル顕微鏡によるAg膜端部における 表面プラズモンの干渉の直接観察	59
芦野 慎*, 八井 崇**, 大津 元一*** (神奈川科学技術アカデミー*, 東工大総理工**)	
【14】 SNOMを用いた時間・空間分解分光へのアプローチ	65
瀧口義浩, 陳 軍, 山本喜久 (新技術事業団)	
【15】 0次元系半導体量子構造の近接場分光	71
戸田泰則*, 興梠元伸***, 永宗 靖***, 荒川泰彦***, 大津元一*** (東工大総理工*, 神奈川科学技術アカデミー**, 東京大学生産研・先端研***)	
【16】 GaAs(111)A面上の横方向p-n接合のフォトンSTMを用いた評価	77
斎藤信雄*, 草野淳一*, 奥村英世*, 斎木敏治**, 大津元一*** (NHK放送技研*, 神奈川科学技術アカデミー**, 東工大総理工***)	